

Saturn系列

激光点共焦螺旋扫描晶圆缺陷检测设备

Laser Scanning Wafer Defect Inspection System



应用范围 Application Scope

晶圆类型

衬底片和外延片的表面及晶格缺陷检测

晶圆尺寸

兼容4, 6, 8, 12英寸及其它非标尺寸

设备特点及优势 Product Introduction

检测方式

激光点共焦螺旋扫描, 多通道同步检测

检测效率

高检测通量 (62 WPH @ 6")

检测能力

全面覆盖各类化合物晶圆缺陷, 支持雾化粗糙度检测

检测通道

明场、暗场(正/斜入射)、形貌(径向/切向)、相位、光致发光(紫外/可见/红外)等

中电科风华信息装备股份有限公司

网 址: <http://www.zdkfh-ie.com/>

电 话: 18636141900

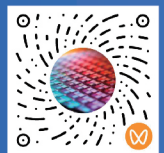
邮 箱: wangze@zdkfh-ie.com

太原基地: 山西转型综合改革示范区潇河产业园宏业东路11号

上海基地: 上海市闵行区浦江镇江月路999号21号楼



公众号



视频号

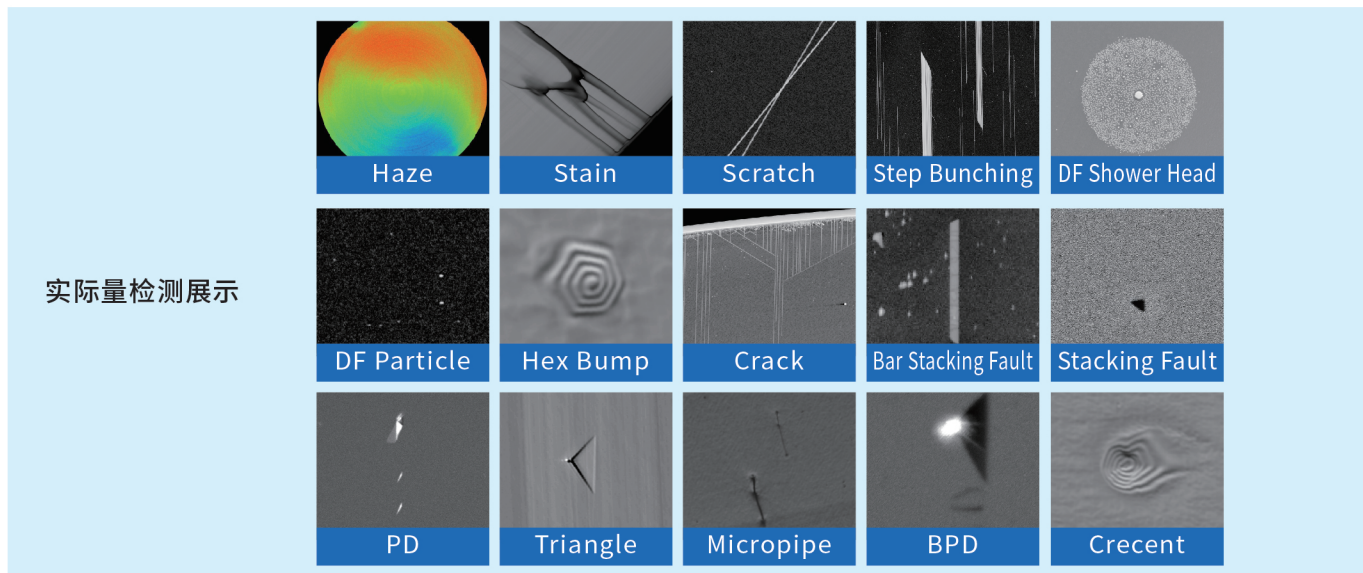
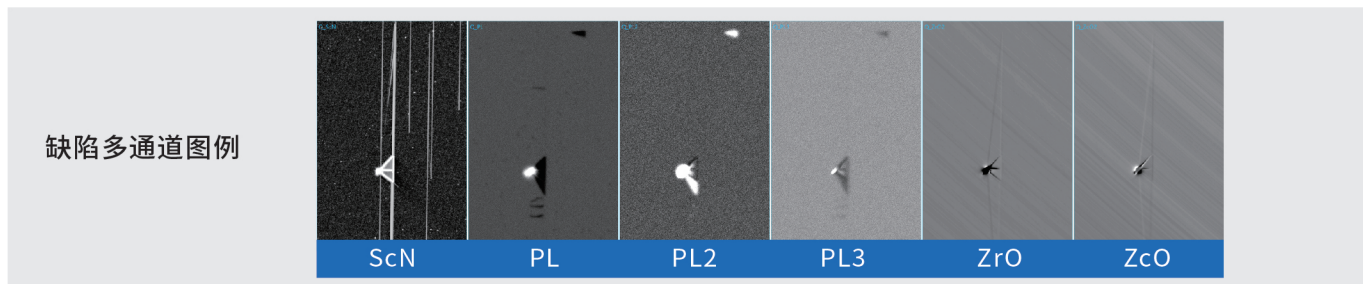
软件算法 Software Algorithm

- ◆ 深度学习结合传统图像的自动检测算法
- ◆ 支持晶圆划分并生成良率分布图
- ◆ 支持缺陷列表筛选、排序及快速查图
- ◆ 多通道同位对比、交叉验证和再分析
- ◆ 可做晶圆判级和自动分拣
- ◆ 支持检测结果关联，云服务数据追溯与共享

性能参数 Performance Parameters

技术参数	性能指标
System Size 设备尺寸	1.535 m (L) x 1.585 m (W) x 2.35 m (H)
Inspection Channels 检测通道	明场 (反射、相位)、暗场 (斜入射/正入射)、形貌 (径向/切向剪切)、光致发光 (紫外/可见/红外) 等多通道同步检测
Throughput 晶圆检测通量	≥62 WPH @ 高生产率模式 (6") ; ≥22 WPH @ 高灵敏度模式 (6") ≥35 WPH @ 高生产率模式 (8") ; ≥13 WPH @ 高灵敏度模式 (8")
Sensitivity 灵敏度	60 nm
Repeatability 重复性	≥99%

检测图例 Inspected Defects



中电科风华信息装备股份有限公司

网 址: <http://www.zdkfh-ie.com/>

电 话: 18636141900

邮 箱: wangze@zdkfh-ie.com

太原基地: 山西转型综合改革示范区潇河产业园宏业东路11号

上海基地: 上海市闵行区浦江镇江月路999号21号楼



公众号



视频号